PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07193358 A

(43) Date of publication of application: 28 . 07 . 95

(51) Int. CI

H05K 3/10

B22D 19/14

B22D 23/06

C04B 37/02

H01L 23/12

H05K 3/00

(21) Application number: 04355211

(22) Date of filing: 17 . 12 . 92

(71) Applicant:

DOWA MINING CO LTD

(72) Inventor.

NEI SHIYOUZAN

SUGANUMA KATSUAKI

(54) MANUFACTURE OF CERAMIC ELECTRONIC CIRCUIT BOARD

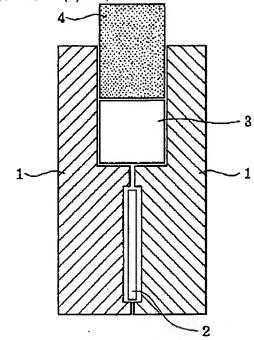
(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the joint strength, heat conductivity and heat resistance characteristics of an aluminium-ceramic composite board by a method wherein after a metal for conductive circuit formation is dissolved, a ceramic board is held and is cooled in a state that it is brought into contact directly to this molten metal.

CONSTITUTION: An aluminium (ceramic) board 2, an aluminium raw material 3 and a graphite piston 4 are installed in a graphite casting mold 1 and the casting mold is put in a furnace heated to 800 to 1000°C The raw material 3 is dissolved and after the molten raw material 3 intrudes into the part installed with the board 2 by the weight of the piston, the casting mold is taken out from the heating furnace and is cooled to room temperatures. The above heating and cooling are performed in a nitrogen atmosphere for the graphite casting mold from being oxidized. A composite board, which is formed in such a way and has an aluminium layer, is subjected to mechanical and electrolytic polishing. The texture of the aluminium part of such the

composite board is dense and the strength of the board is 35kg/cm or stronger.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-193358

(43)公開日 平成7年(1995)7月28日

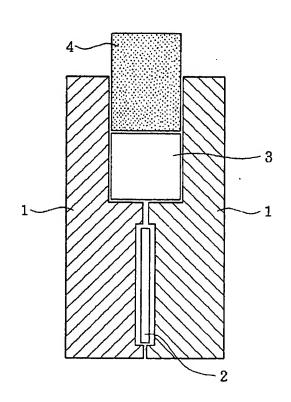
(51) Int.Cl.*		鐵別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H05K	3/10	Z	7511-4E		
B 2 2 D	19/14	С			
	23/06				
C04B	37/02	С			
				H01L	23/ 12
			審查請求	京 有 節求明	項の数2 FD (全 6 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		特顏平4-355211		(71) 出願人	000224798
					同和鉱業株式会社
(22)出願日		平成4年(1992)12月17日			東京都千代田区丸の内1丁目8番2号
				(72)発明者	享、暁山
					東京都秋川市油平52番地2嵯峨窪ハイツ
					201号
				(72)発明者	管沼 克昭
					神奈川県横須賀市久里浜5-11-8コーポ
					杉浦302
				(74)代理人	弁理士 丸岡 政彦
	•				

(54) 【発明の名称】 セラミックス電子回路基板の製造方法

(57)【要約】

【目的】 ろう接法でアルミニウムーセラミックス複合 基板を作製する場合の不十分な安定性、あるいは、非酸 化物系セラミックス基板を用いる場合の工程の複雑化、接合強度や耐熱特性の低下等の問題点を解決して、良好 な接合強度、熱伝導性、耐熱特性を示すアルミニウムーセラミックス複合基板を安定かつ容易に製造できる製造方法の提供。

【構成】 溶融アルミニウムとセラミックス基板とを直接接触させた状態で保持した後冷却し、アルミニウムとセラミックス基板とを直接接合させることを特徴とする。



30

【特許請求の範囲】

【讃求項 1 】 セラミックス基板の少なくとも片面に金 属導電回路を有するセラミックス電子回路基板の製造に おいて、上記導電回路形成用の金属を溶解した後、セラ ミックス基板を上記溶融金属と直接接触させた状態で保 持して冷却することによって金属とセラミックス基板と を直接接合させることを特徴とするセラミックス回路基 板の製造方法。

【請求項2】 上記金属がアルミニウムまたはアルミニ ウム合金であり、上記セラミックス基板がアルミナ、窒 10 化アルミニウムから選ばれる 1 種であることを特徴とす る請求項1記載のセラミックス電子回路基板の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は金属とセラミックスとの 接合体の製造方法に関するものであり、特にパワーモジ ュールのような大電力電子装置の実装に好適なアルミニ ウムーセラミックス複合電子回路基板の製造方法に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】パワーモジュールのような大電力装置の 実装基板としてはセラミックス基板の表面に金属を接合 して作製した金属-セラミックス複合電子回路基板が使 用され、特に電気及び熱伝導性の優れた銅とアルミナあ るいは窒化アルミニウムセラミックスとの複合基板が現 在主に使われている。

【0003】銅とセラミックスとの接合方法として、直 接接合法とろう接法がある。前者は酸化物セラミックス と銅との接合のために開発された技術で、接合するとき に酸素を含有する銅板を使って、不活性雰囲気中で加熱 するか、あるいは無酸素銅を使用して酸化性雰囲気中で 加熱することにより、銅とセラミックスを接合させる方 法である。この方法で非酸化物セラミックスと銅を接合 させる場合、予め非酸化物セラミックスの表面に酸化物 層を形成しなければならない。例えば特開昭59-3077 号 に開示されているように、予め空気中において、約1000 Cの温度で窒化アルミニウム基板を処理し、表面に酸化 物を生成させてから、上述の方法で銅と窒化アルミニウ ムを接合させる。ろう接法は銅とセラミックスとの間に 40 活性金属のろう材を介して接合する方法であり、この方 法では一般にAg-Cu-Ti系ろう材が使用されてい る。

【0004】銅-セラミックス複合基板は広く使用され るにもかかわらず、生産中及び実用上幾つかの問題点が ある。その中で最も重大な問題点は電子部品の実装及び 使用中にセラミックス基板の内部にクラックが生じると とにより発生する基板の表裏間の絶縁破壊である。

【0005】セラミックス基板と銅を接合させる為に、 セラミックス基板と銅が1000°C近くまで加熱され、ま

た、パワーモジュール等の電子部品を実装するときに、 銅-セラミックス複合基板は400 ℃近くまで加熱され る。セラミックスより銅の熱膨張係数は約一桁大きいた め、室温まで複合基板を冷却するときに、熱膨張係数の 違いにより、基板の内部で大きな熱応力が発生する。さ らに電子部品の使用環境、及び使用中の発熱により、基 板の温度が常に変化し、これに対応して基板に作用する 熱応力も変化する。これらの熱応力の作用によって、セ ラミックス基板にクラックが生じる。そのために、セラ ミックス電子回路基板の重要な評価項目の一つである耐 ヒートサイクル特性、つまり-40℃から125 ℃までの温 度範囲で基板の加熱と冷却とを繰り返した場合に、基板 にクラックが発生するまでの繰り返し回数によって評価 される特性値は、直接接合法で作製した銅ーアルミナ複 合基板については20回であるが、ろう接法で作製した同

【0006】銅と同じような優れた電気と熱伝導性を有 するアルミニウムを導電回路材料として使う構想は以前 からあった (例えば特開昭59-121890 号にとのような構 20 想が記述されている)。アルミニウムは銅より軟らか い。その降伏強度は銅の約1/4である。したがって、 アルミニウムを回路材料として使えば、複合基板の内部 に発生した残留応力を大幅に緩和できることが予測でき る。しかし、上記の特開昭59-121890 号の発明ではアル ミニウムとセラミックスとの具体的な接合方法は開示さ れていなかった。特開平3-125463号、特開平4-12554号 及び特開平4-18746 はろう接法でアルミニウム-セラミ ックス複合基板を作製する方法を開示している。これら の文献によると、作製したアルミニウムーセラミックス 基板の耐ヒートサイクル特性は200 回以上で、銅-セラ ミックス基板の約10倍である。

基板のこの特性値は10回以下である。

【0007】しかし、上述の公報に開示されているよう なろう接法でアルミニウムーセラミックス複合基板を製 造するとき、またこのように作成した基板を使用すると きに次の問題点がある。

【0008】1)アルミニウムは酸化しやすいため、上 述の公報に開示された方法は真空または高純度不活性ガ ス雰囲気中において行われなければならない。

【0009】2)アルミニウムの融点は660 ℃と低く、 ろう接温度をとれに近付けると、アルミニウムは全部溶 けて、形状が崩れてしまうか、局部的に溶けて、虫喰い と呼ばれるろう接欠陥が起とる。一方、ろう接温度を低 くすると、ろう材とセラミックスとの反応が起こりにく いため、接合体の強度は弱い。本発明の実施例に示すよ うに、Al-Si系のろう合金を使用する場合、ろう接 は590 °C以上、640 °C以下の温度範囲よりさらに狭い温 度範囲内で行わなければならない。発明者の経験による と、大量生産の場合、特に真空において複合基板を製造 するときには(発熱体からの熱は輻射と伝導だけによっ 50 て伝達され、対流がないので)、炉内の温度を均一にコ 3

ントロールすることは非常に困難である。

【0010】3)ろう接法で複合基板を作製する場合は、ろう接温度がアルミニウムの融点660 ℃以下でなければならない。しかしながら、このような温度では、アルミニウム系ろう材とセラミックスとの濡れ性がよくない。従って、この方法で複合基板を製造するときには、未接欠陥が発生しやすい。

【0011】4)アルミナ基板なら直接ろう接できるが、窒化アルミニウムセラミックス基板の場合、銅を直接接合する場合と同じように、予め窒化アルミニウム基 10板の表面を酸化処理しなければならない。この方法では工程が複雑になるだけではなく、窒化アルミニム基板は本来高熱伝導の要求に対応する為に開発されたものであるのに、表面に酸化物が形成されると、熱伝導特性に悪影響を与えることは言うまでもない。

【0012】5)銅ーセラミックス複合基板の場合と同様に、ろう接法で作製した基板の耐ヒートサイクル特性は直接接合法で作製したものより低いと考えられる。 これは基板の作製に使用するろう合金は純金属より硬く、塑性変形が起こりにくいので、応力の緩和に不利な影響 20を与える為である。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、ろう接法でアルミニウムーセラミックス複合基板を作製する工程に於いては、安定性などの問題点があり、また、セラミックス基板が非酸化物系のものである場合、製造工程が複雑になるという問題点がある。さらに、このように作製した複合基板は接合強度及び耐熱特性等の面において必ずしも最適ではないと考えられる。

【0014】本発明はこのような問題点を克服し、より良い接合強度、熱伝導性、及び耐熱特性を有するアルミニウムーセラミックス複合基板を製造するための、安定且つ便利な製造方法を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明者等はかかる課題 を解決するために鋭意研究した結果、アルミニウムーセ ラミックス複合基板を製造するための斬新な製造方法を 見いだし、本発明を提供することができた。

【0016】すなわち本発明は、(1)セラミックス基板の少なくとも片面に金属導電回路を有するセラミック 40ス電子回路基板の製造において、(ア)上記導電回路形成用の金属をあらかじめ溶解してから、鋳型に鋳込むか、もしくは鋳型において上記金属を溶解すること、

イ)上記鋳型の所定の場所に予めセラミックス基板を配置しておくか、もしくは上記溶融金属の中へセラミックス基板を差し込むかすることによって、セラミックス基板を上記溶融金属と直接接触させること、(ウ)上記セラミックス基板と上記溶融金属を接触させた状態で保持した後冷却し、金属とセラミックス基板を直接接合させることを特徴とするセラミックス電子回路基板の製造方50

法; (2)上記金属がアルミニウムまたはその合金であり、上記セラミックス基板がアルミナ、窒化アルミニウムまたはその他の電子装置の実装に好適なセラミックス基板である上記の製造方法; に関するものである。

[0017]

【作用】発明者等の以前の研究によれば、大気中において加熱すると、アルミニウムの表面に厚い酸化物(アルミナ)の層が形成されるので、アルミニウムとセラミックスとの接合はできない。真空及び不活性雰囲気中においては、アルミニウムとセラミックスとを接合できるが、接合界面部分に薄い酸化物の層が検出され、アルミニウムとセラミックスはアルミニウム表面の薄い酸化膜を介して接合していることがわかる。アルミナに寝われているアルミニウムはセラミックスに対して濡れ性が良くないため、このように作製した接合体の界面部分には未接部が形成され易く、接合強度がばらついていた。

【0018】 このような酸化膜による悪影響を抑えるために、発明者らは以前からアルミニウムに合金元素Si、Ti等を添加し、その効果について調べた。Siには表面の酸化膜を薄くする効果があり、Tiは界面での反応を促進する役割をする。またSiとTiを同時に添加する場合、接合体の強度及び安定性の改善に最も有効であることが確認された。しかし、いずれの場合も、接合体の界面部分から酸化物が検出され、アルミニウムとセラミックスは依然として、酸化膜を介して接合していることが分った。

【0019】アルミニウム表面の酸化物アルミナは化学的に非常に安定で、他の物質と反応しにくい。従って、 とれが界面に存在すると、アルミニウムとセラミックス 30 基板との接合を妨げることが考えられる。

【0020】発明者等が以前行ったアルミニウムとセラミックス粉末との焼結体に関する研究では、アルミニウムとセラミックス粉末の間に酸化膜が介在せず、直接接合している部分があり、またその間にアルミニウムとセラミックスとの反応生成物が形成されていることが判明した。これは粉末を混合、加圧成形する際にアルミニウム粉末表面の酸化膜が破られ、アルミニウムとセラミックス粉末とが直接接触している状態で加熱されたためであると考えられる。この事はアルミニウムとセラミックスとの直接接合の可能性を示唆している。

【0021】本発明者らはアルミニウム表面の酸化膜を除去し、良質な金属-セラミックス複合基板を作製するためにいろいろ試みたが、以下の手段が有効であることがわかった。

【0022】1)金属を溶解し、金属溶湯表面の酸化膜を破るために金属溶湯とセラミックス基板の間に相対運動を起こさせた。もっと具体的に言うと、鋳型の所定の場所に予めセラミックス基板を設置してから溶湯を鋳込むか、鋳込んだ溶融金属の中へセラミック基板を差し込むかすることによって、セラミックス基板を溶融金属と

4

の間に相対運動を起こさせる。

【0023】2)温度が高くなると、金属表面の酸化膜 が分解しやすい為、溶湯の温度を高くすることが好まし い。しかし、溶湯を高温に加熱するには余分のエネルギ ーが必要であると同時に溶湯の蒸発及び溶湯と鋳型との 反応が激しくなる等好ましくないことが起こるので、適 切な溶湯温度は700°C以上、1000°C以下の範囲であり、 この温度範囲では健全な複合基板が作製できる。

【0024】3)溶湯表面の酸化をできるだけ抑えるた めに、溶湯の鋳込み及び基板の差し込みはできるだけ迅 10 速に行う。また製造は大気中において行ってもかまわな いが、酸化防止のために溶解及び鋳込みは真空または不 活性雰囲気中において行うことが好ましい。

[0025]なお、電子回路のパターンの形成方法につ いては、予め鋳型に回路バターンの模様を形成し、直接 回路パターンを形成するか、べたのアルミニウム層を形 成した後、エッチング法で回路パターンを形成する方法 がある。

[0026]

635mm のアルミナ (セラミックス) 基板2 とアルミニウ ム原料3および黒鉛ピストン4を設置し、これをそれぞ・ れ700 ℃ (実験1)、800 ℃ (実験2)、900 ℃ (実験 3)、1000℃(実験4)に加熱した炉の中に入れた。ア*

*ルミニウム原料が溶けて、ピストンの重量で、アルミナ 基板を設置した部分に入り込んだ後、鋳型を加熱炉から 取り出し、室温まで冷却した。なお、本実施例において は、黒鉛鋳型の酸化を防ぐために、加熱および冷却を窒 紫雰囲気中で行った。このように作製した片面で0.5mm 厚さのアルミニウム層を有する複合基板を機械および電 解研磨し、光学顕微鏡でアルミニウムの組織を観察し、 またこの複合基板から幅4mm のピール強度測定用試料を 切り出し、90°ピール強度試験を行った。

【0027】いずれの温度において作製した複合基板 も、そのアルミウム部分の組織は非常に緻密で、気孔、 **巣等鋳物によくある欠陥は一切なかった。また表1に示** すように、複合基板の強度は35kg/cm 以上で、かつ破壊 は界面ではなく、アルミニウム中で起こったので、アル ミニウムがアルミナ基板に強固に接合していることがわ かった。更に、未接欠陥については、700℃で作製した サンブルの中に多少有るが、800 °C以上の温度で作製し たサンブルには一切なかった。

【0028】なお、これらの実施例ではアルミナ基板を 【実施例1】図1に示すように黒鉛鋳型1の中に厚さ0. 20 用いて複合基板を作製したが、発明者の一人は別の発明 において、同じ方法で窒化アルミニウム複合基板が作製 できることを確認した。

[0029]

【表1】

			T				r
		セラミック	ろう	雰囲気	作製温度	アルミニ	ピール強度
		基板	材		(%)	ウム組織	(kg/cm)
	1	アルミナ	_	N2ガス	700	良好	>35*
実	2	アルミナ	_	H2ガス	800	良好	>35
験	3	アルミナ	ı	N2ガス	900	良好	>35
	4	アルミナ	-	N2ガス	1000	良好	>35
	1	窒化アルミ	LS	高真空	- 650	不良	0.9**
比	2	窒化アルミ	ЯS	高真空	650	不良	2. 5**
	3	窒化アルミ	HS	高真空	650	不良	2. 5**
	4	アルミナ	LS	高真空	650	不良	20**
较	5	アルミナ	ИS	髙真空	650	不良	23**
	6	アルミナ	H\$	髙真空	650	不良	29*
	7	アルミナ	LS	高真空	640	良好	0
例	8	アルミナ	us	高真空	640	不良	18**
	9	アルミナ	HS	髙真空	580	良好	0
	10	アルミナ	H S	高真空	590	不良	0

未接部面積が10%以下

未接部面積が10%以上

本明細書に記述した内容から、上述の実施例に示す方法 が唯一の方法ではなく、また本実施例に示すような条件 に限定されるべきではないことが容易に理解されよう。 高圧鋳造、ダイカスト、連続鋳造等各種の方法で複合基 50 元素例えばSi、Ge、Ti、Mg等を添加し、セラミ

板を製造することが可能であり、製造温度での保持時間 を長くし、アルミニウムの中に表面酸化物の分解および 活性化に役立つ合金元素、または融点を低下させる合金 7

ックス基板中の焼結助剤をアルミニウムと反応しやすい 組成にし、またその量を増えさせるような措置をとれ ば、もっと低い温度で複合基板が作製できることが容易 に考えられる。

[0030]

【比較例1~6】比較のためにろう接法でアルミニウム −セラミックス複合基板を作製した。

【0031】2枚の厚さ0.5mm のアルミニウム板がろう材を介して上下から厚さ0.635mm のセラミックス基板をはさむように、アルミニウム板とセラミックス基板をセ 10ットした。との上に更に重りを乗せて、10小の真空において、650°C、20分間保持し、アルミニウム板とセラミックス基板をろう接した。使ったセラミックス基板はアルミナと窒化アルミニウム基板の2種類であり、ろう材は厚さ0.2mm の3種類のA1-Si-Ti合金箔であった。その組成は表2に示されている。複合基板の評価は実施例に示した方法と同じ方法で行った。

[0032]

【表2】

ろう材	組成 (WT%)			
	Si.	Тi	A 1	
L S	0.3	0.25	bal.	
M S	1. 5	0.2	bal.	
H S	1 2	0.2	bal.	

表1に複合基板の評価結果を合わせて示している。HSろう材でろう接した複合基板はアルミニウム板自身が溶けてしまい、形状が崩れてしまった。MSとLSろう材でろう接した複合基板はアルミニウム板が全部は溶けな30かったが、かなりの部分が溶けてしまい、虫喰いろう接欠陥が発生した。これらの試料のビール強度は30kq/cm以下で、特に窒化アルミニウム基板の場合ろう接強度が2.5kq/cm以下であり、基板として要求されるビール強度5kq/cmより低かった。またこれらの複合基板には未接部分の面積がほぼ10%以上あった。

[0033]

【比較例7~8】アルミニウム板の溶解を防ぐために、

ろう接温度を10℃下げて、640 ℃にし、LSとMSろう材を用いて、アルミニウム - アルミナ複合基板の作製を試みた。しかし、表1に示すように、この温度ではLSろう材によるろう接はできなかった。MSろう材によるろう接はできなか。ろう接強度は650 ℃でろう接したものより低くなり、また上述したような虫喰い、未接欠陥が相変わらず発生した。温度をさらに低くすれば虫喰い欠陥をなくせる可能性が有るが、未接欠陥がもっと多く

10 [0034]

なる可能性が有る。

【比較例9~10】ろう接温度をHSろう材の溶融温度(約580℃)まで下げて、アルミニウムーアルミナ複合基板の作製を試みた。しかし、このような低い温度ではセラミックス基板とろう材は接合しなかった。また590℃でろう接した場合、アルミニウム板が一部溶けて、虫喰い欠陥が生じた。これ以上温度を高めることはできないことがわかった。

[0035]以上の比較例からわかるようにろう接法で作製したアルミニウムーセラミックス複合基板は本発明 の直接接合法で作製したものより、接合強度が低く、また未接欠陥が発生する確率が高い。

[0036]

【発明の効果】本明細書に開示したような本発明の方法によれば、従来のろう接法で作製する場合の未接等のろう接欠陥をなくし、アルミニウムとセラミックス基板との高信頼性、高強度接合が実現できる。これによって、耐ヒートサイクル特性が優れた良質なアルミニウムーセラミックス複合基板が製造できる。

【図面の簡単な説明】

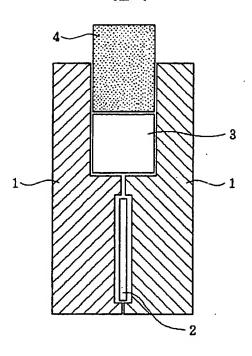
【図1】図1は本発明の実施例においてアルミニウムーセラミックス複合基板を作製するときの鋳型の断面図である。

【符号の簡単な説明】

- 1 黒鉛鋳型
- 2 セラミックス基板
- 3 アルミニウム原料
- 4 黒鉛ピストン

g

(図1)



フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号 庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L 23/12			·
H 0 5 K 3/00	R		•

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成9年(1997)3月7日

【公開番号】特開平7-193358

【公開日】平成7年(1995)7月28日

【年通号数】公開特許公報7-1934

【出願番号】特願平4-355211

【国際特許分類第6版】

H05K 3/10 B22D 19/14 23/06 C04B 37/02 H01L 23/12 H05K 3/00 (FI) H05K 3/10 Z 7511-4E B22D 19/14 C 7356-4K 23/06 8926-4K C04B 37/02 C 9260-4G H05K 3/00 R 6921-4E H01L 23/12 7220-4E

【手続補正書】

【提出日】平成6年3月14日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】 なお、これらの実施例ではアルミナ基板を用いて複合基板を作製したが、同じ方法で窒化アルミニウム複合基板が作製できることを確認した。